



ファイバー端面干渉計

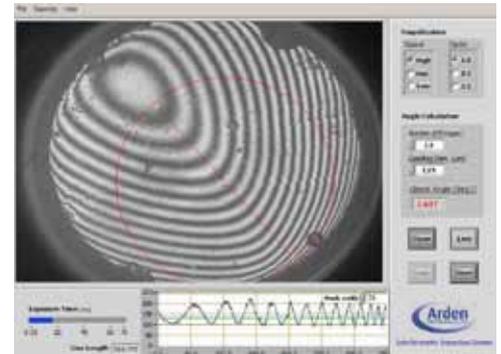
VFI-1200



VFI-1200 はカット、研磨、レンズ化されたファイバー端面のカットング状態や平坦さを測定する測定器です。マイケルソン干渉計を使用した、非常にコンパクトで、簡易な端面検査器で、125 μ m 程度の通信用光ファイバーからファイバーレーザなどの大口径ファイバーのカットング状態をすぐに確認することができます。旧モデル VF-20 から得たノウハウを生かし、5 μ pixel カメラの搭載やコントラスト機能など、より精度の高い観察を実現しております。

特長

- ・ 2つの検査モード
 - Inspect モード
 - Fringe モード
- ・ ファイバーホルダの交換で 0°、8°、それ以外のアングルにも対応可能
- ・ 100 μ m ~ 1200 μ m ファイバー測定可能
- ・ 接続された PC から
 - イメージを簡単セーブ、プリント
 - サンプルをリアルタイムで観測
 - QA レポート機能
 - 干渉縞から端面の平坦さ観測
- ・ フジクラ、VYTRAN 製ホルダー装着可能

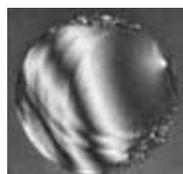


干渉縞からカットング角度を測定

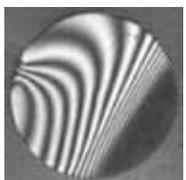
ファイバー端面観測例



ほぼ完璧に
平坦な切断面



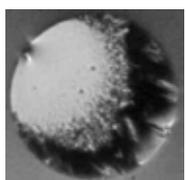
応力皺と
荒い切断面



むしれた
切断面



ほぼ完璧な 2.4°
アングル切断面



非常に汚い
切断面



ブレードダメージ
を受けた切断面

用途

- ・ ファイバーサブアッセンブル製作時のファイバー検査
- ・ ファイバーレーザなどの大口径ファイバのクリーブ検査
- ・ ファイバカット面のアングル測定
- ・ ファイバー加工の検査などに

シリーズ / オプション

VFI-1200 シリーズ

- ・ VFI-1200 125 ~ 1200 μ m ファイバー使用可能
- ・ VFI-200 125 μ m ファイバーのみ使用可能

オプション

- ・ VF-H0 / 125 125 μ m ファイバー：0°カット用
 - ・ VF-H8 / 125 125 μ m ファイバー：8°カット用
 - ・ VF-H0 / 200 200 μ m ファイバー：0°カット用
 - ・ VF-H0 / 800 800 μ m ファイバー：0°カット用
 - ・ VF-H0 / 1000 1000 μ m ファイバー：0°カット用
- 他仕様も可能です。



光技術をサポートする
株式会社オプトサイエンス

<http://www.optoscience.com>

東京本社 〒160-0014 東京都新宿区内藤町1番地 内藤町ビルディング TEL:03-3356-1064
大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島7-7-2 新大阪ビル西館 TEL:06-6305-2064
名古屋営業所 〒450-0002 名古屋市中村区名駅2-37-21 東海ソフトビル TEL:052-569-6064

E-mail : info@optoscience.com